

O B S A H

Rejstřík autorů	6
Úvod	7

Sekce I - Perspektivy diagnostiky

1. Metody umělé inteligence v diagnostice P. Kučera	8
--	---

Sekce II - Simulace

2. Metody simulace poruch v logických obvodech P. Slaba	19
3. Poruchový simulátor pro kombinačné obvody M. Višniar	29
4. Modelování a simulace HP 205/XXX E. Štěpánová	32

Sekce III - Testery desek

5. Testery desek : historie a perspektiva K. Uhlíř	37
6. Problematika stimulace v in-circuit testeru P. Strnad	48
7. Programové vybavení ZPO-85 Z. Pokorný	52
8. Autodiagnostika testeru ZPO-85 T. Lukáš	56
9. Problémy spojené se stavbou testeru pro desky s vesta- věnou diagnostikou J. Zakopal	60
10. Testování osazených desek s mikroprocesory ve výrobě R. Bukovský, S. Havel	64

Sekce IV - Diagnostika obvodů LSI a VLSI

11. Problémy diagnostiky obvodov CMOS P. Gramata, P. Braun	68
12. Návrh a testování HP 205/XXX K. Vlček	75
13. Generování testu statických parametrů HP 1000 J. Rada, J. Vacovská	80

14. Způsob měření dynamických parametrů HP 1000	
E. Kottek	84
15. Analýzy poruch VLSI pomocí elektronového mikroskopu	
O. Novák	88

Sekce V - Testery součástek

16. Technické a programové vybavení testeru hradlových polí	
M. Pavel, R. Trnka, J. Vacovská	92
17. Koncepce testeru hradlových polí CMOS Tesla VÚST	
J. Hoherčák, S. Novák	96
18. Komparační tester obvodů CMOS	
J. Bernkopf	101
19. Malý laboratorní tester pamětí	
E. Valášková	105
20. Provozní zkušenosti z nasazení testeru TOA - 1	
F. Šícha	109
21. Programovatelný časovací generátor 10 MHz	
M. Bajtoš	113
22. Konstrukce zpožďovací linky pro tester	
P. Suchyňa	117

Sekce VI - Generování testů

23. Systém automatického generování testov pre kombinačné obvody	
E. Gramatová, L. Bučko, M. Fischerová	121
24. Návrh algoritmů pro funkční testování mikroprocesorů	
P. Caisl; J. Vlnas	127
25. Analýza testovatelnosti obvodu na úrovni RTL	
Z. Kotásek	131

Sekce VII - Systemová diagnostika

26. Dialková diagnostika neprístupného mikropočítačového systému	
M. Šnajder	135
27. Test čtení paměti MP systému	
J. Adámek	139

28. Řadič magnetopáskové jednotky se snadnou diagnostikou J. Štella	143
29. Využití osobního počítače pro testování střediskového systému T. Blažek	147
30. Lokalizace poruch analýzou log-outu P. Hrdlička, M. Tomášek	151
31. Diagnostický obvod pro jednočipové mikropočítače P. Bürger, Z. Pícha	155
32. Vstavany test jednočipového mikropočítača MCS-48 J. Hudec	159
33. Dvojúrovňová diagnostika víceprocesorového systému M. Lukeš	163
34. Diagnostika analogové části hybridních systémů říze- ných mikropočítačem K. Červenka, V. Flídr	167

Sekce VIII - Zabezpečení mikroprocesorových systémů

35. Rychlá násobička s průběžnou detekcí chyb V. Drábek	171
36. Zabezpečení přenosu dat mikroprocesorem 8748 P. Šíp	175
37. Diagnostické vybavení rychlého bipolárního procesoru J. Kupka	179

Sekce IX - Ekonomické aspekty diagnostiky

38. Ekonomika testování P. Míček	183
39. Kritéria výběru ATS osazených desek z hlediska ekonomiky testování A. Müller	188
40. Výrobní testery integrovaných obvodů P. Kaluža, A. Benek	192